



中华人民共和国国家标准

GB/T 17024—1997
idt IEC 748-2-3:1992
QC 790130

半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第三篇 HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列空白详细规范

Semiconductor devices Integrated circuits
Part 2: Digital integrated circuits
Section three—Blank detail specification
for HCMOS digital integrated circuits
series 54/74HC, 54/74HCT, 54/74HCU

1997-10-07 发布

1998-09-01 实施

国家技术监督局 发布

前 言

本标准等同采用国际电工委员会标准 IEC 748-2-3:1992《半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第三篇-HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列空白详细规范》,以促进我国该类产品的国际贸易、技术和经济交流。

本标准引用的国家标准 GB/T 4937—1995 半导体器件 机械和气候试验方法 [idt IEC 749 (1984)]及修改单 1(1993)和修改单 2(1993)。

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国集成电路标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:电子工业部东北微电子研究所、电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人:王连友、毕思庆、李燕荣。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准是由 SC47A(集成电路)和 IEC TC47(半导体器件)制定的。

本标准是 HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列的空白详细规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告	二个月程序	表决报告
47A(CO)190	47A(CO)215	47A(CO)211	47A(CO)241

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

在本标准封面的 QC 编号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准引用下列 IEC 标准:

68-2-17(1978) 环境试验 第 2 部分:试验——试验 Q 密封

617-12(1991) 图形符号 第 12 部分:二进制逻辑单元

747-10(1991) 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

748-2-2(1991) 半导体器件 集成电路 第 2 部分:数字集成电路 第二篇——HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列族规范
修改单 1(1994)

748-11(1990) 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)

749(1984) 半导体器件 机械和气候试验方法
修改单 1(1991)

QC 001002(1986) IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则

中华人民共和国国家标准

半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第三篇 HCMOS 数字集成电路 54/74HC、54/74HCT、54/74HCU 系列空白详细规范

GB/T 17024—1997
idt IEC 748-2-3:1992
QC 790130

Semiconductor devices Integrated circuits
Part 2: Digital integrated circuits
Section three—Blank detail specification
for HCMOS digital integrated circuits
series 54/74HC, 54/74HCT, 54/74HCU

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 的章程,并在 IEC 授权下进行工作。这个体系的目的是确定质量评定程序,使得由一个成员国根据相应规范要求认为合格而放行的电子元器件,在所有其他成员国国内不需要再进行检验就能同样地承认其合格。

本空白详细规范是与半导体器件有关的一系列空白详细规范之一,并且与下列标准一起使用。

IEC 747-10/QC 700000 半导体器件 第10部分:分立器件和集成电路总规范

要求的资料

本页和下页括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,应填写在相应的栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范、分规范的编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

- [5] 主要功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和外壳资料。
如果器件具有若干种派生产品,则应指出其差别,例如用对照表列出特性。
如果器件属静电敏感型,应在详细规范中注明注意事项。
- [7] 外形图、引出端识别、标志和/或有关外形的参考文件。